

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
(СПбГТИ(ТУ))

УЧЕБНЫЙ ПЛАН¹

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
(далее - программа)

Учебный план программы «Применение атомно-силовой микроскопии для анализа
низкоразмерных систем»

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего часов	В том числе:			Формы контроля*
			Лекции	Практические и лабораторные занятия	Самостоятельная работа	
1	Классификация низкоразмерных материалов	1	1			
2	Основные технологии и особенности получения конформных нанопокровов	3	3			
3	Методы сканирующей зондовой микроскопии	8	4	4		
4	Применение АСМ для анализа морфологии и свойств наноразмерных пленок	4	2	2		
	Итоговая аттестация	2				зачет
	Итого	18	10	6		2

* - промежуточная аттестации и текущий контроль в программе не предусмотрены

¹ Составлен на основании раздела 3 утвержденной программы и установленного макета